

R-5920MK2 / R-5940A

多ピン対応新モデル / MLCCs及びIPDs向け高速テスター

New tester model for multi-pin/High-speed Testing Focused on MLCCs and IPDs

R-5920MK2

測定条件の拡張により効率化を実現する新モデル

Achieved increased efficiency through expanded measurement conditions

検査項目 Inspection item

- New 4W parallel testing **NEW**
- 4w+40mA, 60mA **NEW**
- E-Cleaning 200mA **NEW**
- GND_LEAK& Acceleration
- 4Wplus
- Kelvin- Spark Power Cut
- Kelvin- Spark
- HP_4W

4W検査速度UP

Acceleration of 4W parallel testing

スキャナユニットに**「指定ポイント出力引き込み機能」**を追加
電圧出力を狙ったポイントへ誘導し、一括で確実な判定を実現

"Designated point output pull-in function" is directed to the scanner unit
to the point where additional voltage output is targeted
to achieve a unified and reliable decision.

LEAK検査速度UP

Acceleration of parallel inspection

隣接していないNetをCADデータから特定し、同時に並列検査。
1対ALLで対応するより、早いスピードで検査可能。

Identified non-adjacent Net from CAD data
and simultaneously inspected in parallel.
It can be inspected faster than one-to-ALL response.

4W検査精度UP

Improved 4W inspection accuracy

40mA / 60mA のワイド電流検査可能

・ノイズ防止：ノイズを遮断し、クリーンな測定を実現

・高精度判定：データのバラツキを抑え、検査品質を安定化

40mA / 60mA Wide current inspection

・Noise Prevention: Blocks noise and provides clean measurement

・High-precision determination: Reduce data variability and stabilize inspection quality

コンタミクリーナー機能改善

Improved contamination of E-Cleaning

クリーニング電流を100mA ~ 200mAまで自由に変調及び制御可能。
ピンの接続抵抗をより正確に排除。

100 mA cleaning current ~ It can be freely modulated
and controlled up to 200 mA.
Eliminated pin connection resistance more accurately.

R-5940A

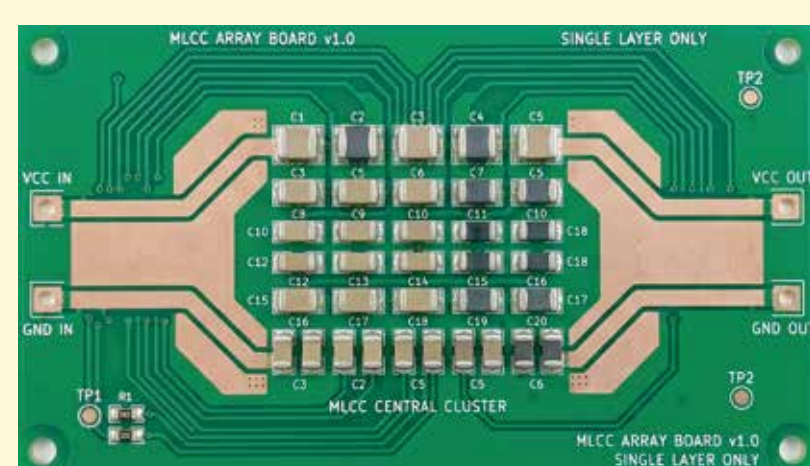
MLCC向けハイスピード検査、Active Device向けの検査機能を搭載

High-speed testing for MLCCs and testing functions for active devices

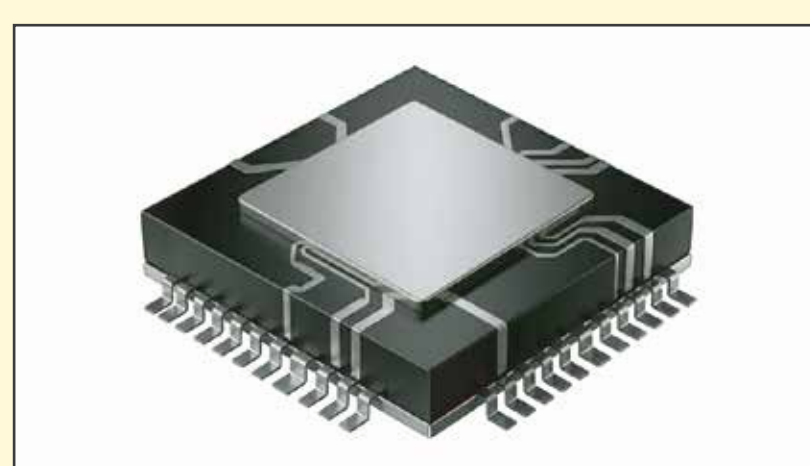
MEMS MIC IC等をコントロールし消費電力の計測が可能
Enables power consumption measurement by controlling MEMS MIC ICs

従来テスターと比べて静電容量の測定速度アップを実現
Achieved faster capacitance measurement speeds
compared to conventional testers

4 parallel	New 4W parallel testing	GND_LEAK & Acceleration
WR- μSHORT	4w +40mA, 60mA	E-Cleaning 200mA
HP_4W	Kelvin- Spark Power Cut	
Kelvin- Spark	4Wplus	

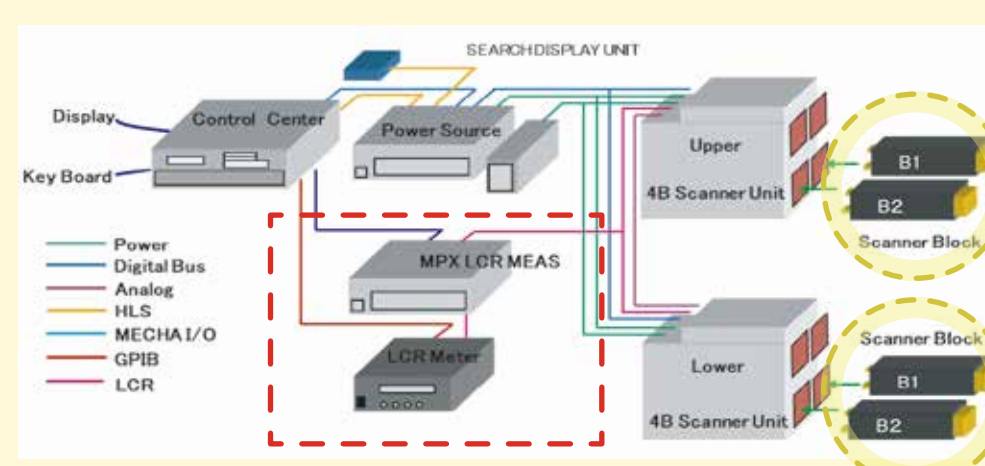


■ MLCC



■ IPD

	Item	Application	Image
Passive	L,C,R components Coil Patter IPD Capacitance Inductance	Smart Phone Camera Image stabilization Advance Package	
	L,C,R Network	LDO circuit MEMS microphone circuit	 ■ LDO回路 ■ マイク回路
Active	(Not Function) IC-Connect IC-Leak	SSD, RF Device IPM (Intelligent Power Module)	
	(Function) Power consumption Signal Generator I2C SPI	Active Device (IC) High-speed Capacitance Testing Focused on MLCCs&IPDs	



スキャナカード自体にLCRメーターを
直接内蔵。合計64基のLCRメーターによる
「同時並列検査」を実現。

Built directly into the scanner card itself
with a total of 64 LCR meters
"simultaneous parallel inspection."

国内拠点

・京都(本社)
617-0007 京都府向日市ニデックパーク33番地C棟
TEL 075-280-8101 / FAX 075-280-8106
・名古屋
503-0974 岐阜県大垣市久瀬川町1-3
TEL 0584-83-7680 / FAX 0584-83-7685
・東京
141-0032 東京都品川区大崎1丁目20番13号 Nidec東京ビル
TEL 03-3494-7970 / FAX 03-3494-0793

海外拠点

・台湾 NIDEK ADVANCE TECHNOLOGY TAIWAN CORPORATION
・韓国 NIDEK ADVANCE TECHNOLOGY KOREA CO., LTD.
・中国 NIDEK ADVANCE TECHNOLOGY ZHEJIANG CORPORATION
・タイ NIDEK ADVANCE TECHNOLOGY THAILAND CO., LTD.
・マレーシア NIDEK ADVANCE TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.
・ベトナム NIDEK ADVANCE TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.
・インド NIDEK ADVANCE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
・カナダ NIDEK ADVANCE TECHNOLOGY CANADA CORPORATION